

X射线荧光镀层厚度测量仪 FT150 - 软件概要 -

2015. 2

X射线荧光镀层厚度测量仪作为一种可高速、简便地对电子零件等的镀层，半导体工艺中的薄膜，以及汽车部件中各类工业产品表皮膜等的膜厚进行管理的仪器而被广泛应用。

FT150利用多毛细管所产生的照射直径为30 μm的高强度X射线光束，最适于测量微小连接器、柔性电路板及导线架等微小零件及超薄镀层。

- 通过优化X射线光束与检测器，与本公司以往机型相比，效率提高2倍（与本公司以往机型FT9550X相比）
- 对装置设计进行了全面改进，查看样品室及测量位置的确认更加容易，大幅提高了操作性。
- 产品线增加了FT150h，搭载了可测量超微部分的锡（Sn）及银（Ag）等的高能量元素的专用X射线发生系统。
- 利用新开发的软件“XRF controller”，可提高用户管理设定、操作导航及大型图标操作性，实现数据库的综合数据管理。

此份资料中主要包括了FT150的软件概要。



FT-150系列

软件概要

简单直观的操作画面

以Lancer画面为中心选择每个测量样品预先登录的应用图像来进行测量。由于设计好的应用大图标中可登录每个应用样品的照片及层构造图像，测量者在视觉上就可辨别并立刻开始进行测量。



图1 Lancer画面及应用大图标

利用数据库可对数据统一管理

测量数据与样品图像及能谱文件等相关数据相加，自动保存进数据库后统一管理。可检索样品情报（日期、样品名、批数、测量者等）各种条件，可快速简便的找到目标数据。



图2 检索窗口及测量数据浏览画面


日立仪器(上海)有限公司
 Hitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd.

本社：上海市浦东新区张江高科技园区碧波路690号2号楼102室 TEL:+86-21-5027-3533
 东莞分公司：广东省东莞市长安镇长青南路306号金业大厦4楼 TEL:+86-769-8584-5872

通过测量导航的操作指南

测量导航与测量画面联动，同步介绍正在工作的内容。

- 样品设置
- 测量定位
- 测量开始
- 测量报告生成
- 测量结束

在介绍每个阶段的工作内容时，测量者可随其轻松进行测量，提高了工作效率，减少了工作失误。



图3 测量导航

丰富的自定义功能

通过用户管理设置，可对用户权限进行细致的设置。可限制分析条件变更或数据遗失等的基础用户模式可以防止未预期数据的毁坏及遗失。另外，测量中不需要的情报可以不表示出来，测量者可集中精神测量。



图4 自定义画面

利用触摸屏直观操作

利用触摸屏（选购项）可设定样品，触碰到面中样品的图像，确定位置后快速进行测量。



图5 触碰操作